

第28回機器分析講座プログラム

「赤外分光分析の応用」

日時：平成26年8月28日（木）

会場：静岡理科大学 教育棟5階505教室

（実習：先端機器分析センター）

9:00-10:00	受付	
10:00-10:05	開会挨拶	静岡理科大学 先端機器分析センター長 吉田 豊 静岡県工業技術研究所浜松工業技術支援センター センター長 杉山 治氏
10:05-11:30	講義1	FTIRを使った半導体結晶中の軽元素の評価 神奈川県産業技術センター 機械・材料技術部長 小野春彦氏
11:30-13:00	昼食	
13:00-14:00	講義2	FTIRによる金属腐食生成物の解析 静岡県工業技術研究所浜松工業技術支援センター 上席研究員 吉岡正行氏
14:00-14:15	休憩	
14:15-15:45	講義3	赤外・ラマン分光法の基礎と最新の装置・応用事例 日本分光株式会社 分光分析技術部 応用技術課 田村耕平氏
15:45-16:00	移動	（教育棟から先端機器分析センターへ）
16:00-17:00	実習	赤外分光光度計（FTIR）を使ったデモ実演と講師への質疑 ジャスコエンジニアリング株式会社 佐藤慎也氏

